

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

12 Offenlegungsschrift
10 DE 43 25 724 A 1

51 Int. Cl.⁶:
G 01 N 23/00
G 02 B 21/00
A 61 B 10/00
H 01 J 37/256
A 61 N 5/10
G 01 N 21/00
G 01 N 21/17
G 01 N 21/62
A 61 B 6/00
A 61 N 5/06

21 Aktenzeichen: P 43 25 724.0
22 Anmeldetag: 30. 7. 93
43 Offenlegungstag: 2. 2. 95

DE 43 25 724 A 1

71 Anmelder:
Debbage, Paul, Dr., 86415 Mering, DE

74 Vertreter:
Tetzner, M., Dipl.-Ing.-Univ., Pat.-Anw.; Tetzner, V.,
Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Dr.jur., Pat.- u. Rechtsanw., 81479
München

72 Erfinder:
gleich Anmelder

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE 41 28 744 C1
DE 34 39 287 C2
DE 28 29 516 C2
DE 27 43 009 C2
DE 41 38 111 A1
DE 40 26 821 A1
DE 39 08 928 A1

DE 38 20 862 A1
DE 36 36 506 A1
DE 33 19 203 A1
DE 30 40 831 A1
DE 29 53 050 A1
DE 92 02 539 U1
US 50 57 102
US 50 08 907
US 49 95 068
US 48 15 448
US 44 23 736
US 37 94 840
EP 04 68 255 A2
WO 91 10 473
SU 5 53 766
SU 4 05 236

JP 63-300942 A. In: Patents Abstracts of Japan,
P-850, March 31 1989, Vol.13, No.131;

54 Vorrichtung und Verfahren zur Untersuchung eines Objektes und zur Einwirkung auf das Objekt

57 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Untersuchung eines Objekts und zur Einwirkung auf das Objekt, wobei die von einem Objekt ausgehende Strahlung von einem Detektor empfangen wird, der ein entsprechendes Detektorsignal erzeugt. Dieses Detektorsignal wird derart weiterverarbeitet, daß eine nicht fokussierende Einrichtung zur gerichteten Bestrahlung der Teilfläche des Objekts in Abhängigkeit vom Detektorsignal angesteuert werden kann.

DE 43 25 724 A 1